

性能及测试方法

■性能及测试方法（芯片形3端子电容器）

		性能		测试方法及条件 (根据JIS C 5101-1)
		CG, UJ 特性	R, X 特性	
介电损耗因数		2.5%以下 * 每个品种的性能规格不同。详细请参照各品种规格书。		CG特性 : 1MHz R特性 : 1kHz 测定电压 : 0.5~2Vrms
耐电压		无绝缘击穿, 无破损。		直流电压施加时间 : 1~5秒间 CG特性 : 额定电压的300%施加 R特性 : 额定电压的250%施加
绝缘电阻		不低于10,000MΩ或500MΩ·μF, 以较小值为准。		施加电压 : 额定电压 施加时间 : 1分钟
粘附强度		端子电极无剥离或剥离征兆。		荷重 : 5N 保持时间 : 10秒
耐振性	外观	无明显损坏		振动频率范围: 10~55Hz 全振幅: 1.5mm, 10~55~10Hz 1分 XYZ方向 各2小时 计6小时
	静电容量	在规定公差范围内		
	静电正切	满足初始规格值		
耐焊接热性	外观	无明显损坏		进行热处理。 温度: 270±5℃ 浸入时间: 10±1秒 预热: ①80~100℃ (1~2分) ②170~200℃ (1~2分) 预热后、进么连续焊接浸入。
	静电容量变化率	不高于±2.5%或±0.25pF, 以较大值为准。	±7.5%以下	
	Q值及介电损耗因数	满足初始值		
	绝缘电阻	满足初始值		
	耐电压	无绝缘击穿, 无破损		
焊接性		新焊料应覆盖端子电极面75%以上。		温度: 230±5℃ 浸入时间: 2±1秒
温度循环	外观	无明显损坏		常温→最低使用温度→常温→最高使用温度 3分→ 30分 →3分→ 30分 上记1~4阶段的温度顺序放置1个循环。 这个操作反复进行5个循环。
	静电容量变化率	不高于±2.5%或±0.25pF, 以较大值为准。	±7.5%以下	
	Q值及介电损耗因数	满足初始值		
	绝缘电阻	满足初始值		
	耐电压	无绝缘击穿, 无破损		
耐湿负荷	外观	无明显损坏		进行电压处理 测试温度: 40±2℃ 相对湿度: 90~95RH 测试电压: 额定电压 测试时间: 500小时
	静电容量变化率	不高于±5.0%或±0.5pF, 以较大值为准。	±12.5%以下	
	Q值及介电损耗因数	5%以下		
	绝缘电阻	不低于1,000MΩ或50MΩ·μF, 以较小值为准。		
高温负荷	外观	无明显损坏		进行电压处理 测试温度: 最高使用温度±3℃ 测试电压: 额定电压×200%的直流电压 测试时间: 1000小时 * 各品种的测试条件不同。详细请参照个别品种规格书。
	静电容量变化率	不高于±3.0%或±0.3pF, 以较大值为准	±12.5%以下	
	Q值及介电损耗因数	4%以下		
	绝缘电阻	不低于1,000MΩ或50MΩ·μF, 以较小值为准		
弯曲度	外观	无明显损坏		进行热处理。 弯曲量: 1mm 移动速度: 0.5mm/sec 测试中要连接上电容计。 
	静电容量变化率	不高于±5.0%或±0.5pF, 以较大值为准。	±12.5%以下	

注1: 根据品种性能工艺不同。详细请确认个别工艺书。

注2: 热处理150+0/-10℃ 1小时后、室温中取出放置48±4小时。

注3: 电压处理在规定的测试条件1小时处理后, 室温中取出放置48±4小时。